平成２６年６月２０日

各　　位

会　社　名　株式会社日本マイクロニクス
代表者名　代表取締役社長　長谷川正義
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６８７１）
問合せ先　常務取締役管理本部長　齋藤　太
Ｔ　Ｅ　Ｌ　０４２２－２１－２６６５

株式会社テラプローブとの共同開発によるモバイル用メモリ向けの効果的なテスティング方法の確立に関するお知らせ

株式会社日本マイクロニクス（代表取締役社長　長谷川正義、以下「当社」）はこの度、株式会社テラプローブ（代表取締役社長　渡辺雄一郎）と共同で進めておりましたモバイル用メモリ向けの効果的なテスティング方法の確立を実現し、提供を開始しましたので、お知らせいたします。

記

１．開発・製品化の背景、概要

スマートフォンやタブレット等のモバイル端末は、新興国での普及に伴い、従来よりも幅広い価格帯の製品が出てきております。今後もその需要は益々増えていくことが予測されており、そのような背景のもと、モバイル用メモリのテスト工程では、効率的かつ低コストなテスティング方法の要望が強まっておりました。

これに対し、当社と株式会社テラプローブは共同でテスターの持つリソースを最大限に活用する効果的なテスティング方法の開発を進めておりましたが、この度、世界初 2,000DUT 同時計測する方法を実現し、提供を開始いたしました。

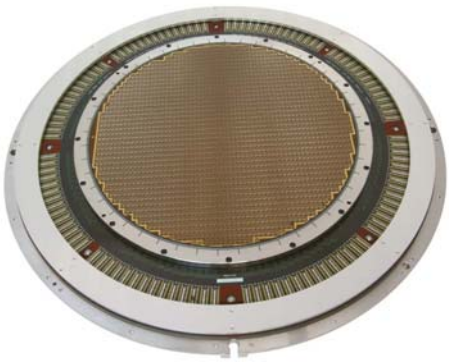
２．主な仕様・特徴

（１）テストの特徴

① プロセス微細化によるチップ数増加に伴うテストコスト上昇を抑制
② プロセス微細化に伴う品質問題に対応

（２）プローブカード仕様

① プローブカードタイプ　　MEMS プローブ
② DUT 数　　2,000DUT（世界最大）
③ 熱による針位置ズレの最小化を実現
④ Pin 数増大でも安定したコンタクト性を実現



製品に関するお問合せ先
プローブカード事業部　営業統括部
TEL 0422-21-0155

以　上